

Visionline V200

光学自动内孔表面缺陷检测系统



Visionline V205 光学缺陷检测系统

优势

- 可靠、可重复，测试结果自动保存
- 光学检测原理，无磨损，可靠
- 快速检测和节拍短
- 更换工件时，系统易于切换程序
- 带测头碰撞保护
- 测量结果不受操作员影响
- 减少误判和无法识别的缺陷（划痕）

系列的亮点

- 紧凑的测试系统，对空间要求最小
- 用于制造业的稳固设计
- 安全操作的光障
- 测试不同的孔径产品
- 可选电动的X和Y轴用于精确的工件定位
- 经过验证的技术与360°光学系统
- 在运动中捕捉图像，以获得快速的结果
- 正面碰撞保护
- 可与QDA系统连接

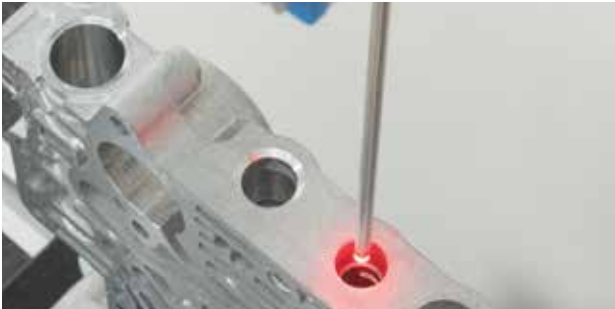
内孔的高效缺陷检测方案

- Evovis Vision软件具有实时模式和广泛的评估和分析功能
- 精确检查内孔表面
- 高分辨率、不失真的表面图像
- 对典型的表面缺陷进行检测和分类，如气孔、毛孔、划痕、压痕等
- 在工艺上可靠的区分缺陷和边缘
- 自适应的动态遮蔽，用于可靠的边缘检测

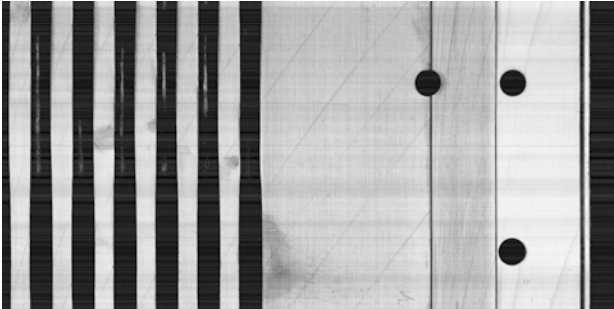
HOMMEL-ETAMIC

A member of the JENOPTIK Group

Visionline V200
光学内孔检查

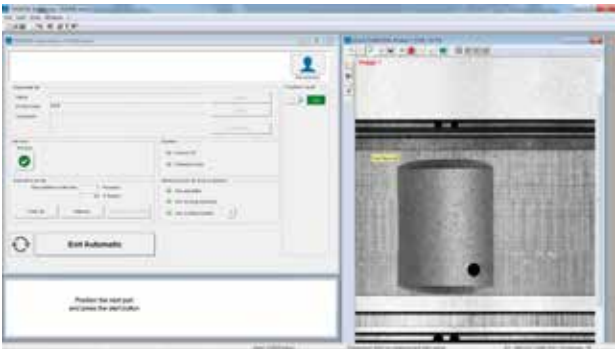


检查孔的内表面



展开的成像

Evovis Vision 检验评估软件



图形化的、以功能为导向的用户界面保证了您对测试系统的简单和无误的操作。众多的功能和向导以及针对特定工件的简单设置为软件的操作提供了便利。

Evovis Vision能够对缺陷以及横向孔和倒角进行强有力的检测和评估，并提供清晰的记录结果和详细显示。

技术参数

系统	Visionline V205	Visionline V220
传感器	B5	B20
测量直径	5 – 14 mm	14 – 50 mm
最大探测深度	190 mm	250 mm
缺陷识别极限	100 µm	
工件		
最大 工件高度（包括夹具）	400 mm	
最大 工件尺寸 [长 x 宽]	520 x 150 mm	

版本	带底架	桌面
尺寸和重量		
高度	2175 mm	1290 mm
宽度（不含显示器/键盘支架）	920 mm	
带显示器/键盘支架的宽度	1533 mm	
深度	930 mm	
重量	350 kg	280 kg